

DMS Go+シリーズ

DMS Go+シリーズは操作性と携帯性を追求した、
Aスコープ表示付超音波厚さ計



高性能・携帯型・簡単操作・Aスコープ表示付超音波厚さ計

DMS Go+シリーズは、幅広い検査対象や使用環境で実施される、厚さ測定、データ保存、データ管理に対し、総合的な携帯型ソリューションを提供します。

単純なAスコープでの波形確認から、Bスコープでのフルデータ保存機能まで備え、DMS Go+ひとつで腐食検査のニーズに対応します。

用途に応じて選択できる3モデル

DMS Go+ Basic

優れた基本性能と経済性



- 簡単操作、Aスコープ表示、頑丈さと信頼性、IP67規格適合
- 高品質なD-Meter二振動子探触子の使用が可能、広範な腐食検査に対応

DMS Go+

充実した測定・表示機能



- Bスコープ表示（タイムベース）による断面表示
- 一振動子探触子による精密厚さ測定、読み値の温度補償

DMS Go+ Advanced

全ての機能を搭載



- 6種類のデータ保存ファイル構成 + UltraMATEによる3Dおよび4D機能に対応
- TopCOAT / Auto-V測定機能により、コーティングの影響を取り除いての評価に

直感的で使いやすい矢印キーパッドを採用、パワフルなデータ管理機能、最新のエレクトロニクスを全モデルで備え、精密で信頼性のある総合的な厚さ測定データを提供します。

各モデルは、簡単なソフトウェアのアップグレードでDMS Go+の上位モデルの機能を追加できるため、強力な柔軟な非破壊検査ツールである携帯型超音波探傷器USM Go+としても使用可能です。

DMS Go+の全モデルが、高品質、高性能なGEのD-Meter二振動子接触子と互換性を持ち、DMS Go+とDMS Go+ Advancedは、精密測定用の一振動子接触子とも互換性を持ちます。さらに、DMS Go+ Advancedは、TopCOAT / AUTO-V技術によりコーティングを通しての測定も可能です。



人間工学に基づく簡単操作

- 直観的な矢印キーパッドによる設定パラメータの操作が可能
- 片手での操作、片手での校正プロセスへのアクセスが可能
- フリップ機能により右手操作、左手操作の切り替えが可能
- ユーザの好みに応じ、スクリーンの縦表示、横表示が可能
- 800×480ピクセルの人間工学に基づいたサイズのスクリーンにより目の疲れを抑制し、様々な環境での明るさに応じた最適な視認性を得た調整が可能
- コンパクトなサイズ、軽量(870g)、厳しい環境下で使用できるよう、IP67に適合した頑丈な構造
- バッテリー動作約10時間（本体に取り付けた状態でも充電可能）
- パスワードで保護された上級ユーザ／一般ユーザ別のモード切替により、オペレータ、用途に適合

高性能・再現性

- ゼロクロス測定により安定し、信頼できる厚さ測定が可能
- AGC（自動ゲインコントロール）により再現性のある厚さ測定および腐食のモニタリングが可能
- 温度補正機能搭載（540°Cまで）*
- 厚さ測定に最適な校正モードとゼロ点調整方法の選択が可能
- アプリケーションに合わせて表示形式の選択が可能（Aスコープ、最小値/最大値、差厚測定値*）
- パラメーターセットの保存と簡単なロードにより、検査の再現性の確保が容易



High quality Krautkramer D-meter probes are compatible with all DMS Go+ models

高性能なデータレコーダとパワフルなデータ管理システム

- オンボードのデータレコーダには、数千もの測定結果を、Aスコープ、BスコープおよびMicroGridアタッチメントと共に保存が可能。DMS Go+ Advancedでは、ボイラー、カスタムグリッド、3D&4Dファイル構成といった拡張データ保存機能を提供。（3D & 4Dファイル構成はUltraMATEで使用可能）
- SDカードもしくはUSBポート経由でデータのやり取りが可能。データは各種フォーマットでエクスポートできるため、ユーザのデータ管理システムに簡単に取り込みが可能
- エクスポートデータは（CSV, PDF, DAT, XML, JPGスクリーンキャプチャ）のファイルフォーマットを選択可
- データ管理ソフトウェアUltraMATEおよびUltraMATE Liteにより、データの総合的な分析および文書化が可能
- 汎用探傷スキャナで採取した、リスクベースデータの管理・分析ソフトウェアと互換性あり。他ソフトウェアとの連携のためのソフトウェア開発キット（SDK）も用意

* DMS Go+ Basicには含まれない

幅広いアプリケーションに対応

DMS Go+シリーズは、産業分野および製造過程における幅広い様々な検査での厚さ測定に適しています。とりわけ、コーティングのある機器、

構造物、および高温下においても腐食検査およびそのモニタリングに適用できます。

代表的な検査対象：

オイル＆ガス分野

- チューブ、容器、タンク等の腐食検査およびモニタリング
- ペイントコーティングを通しての残厚の測定

航空宇宙分野

- メンテナンス

金属産業

- オーステナイト系金属の厚さ測定

発電分野

- 複雑形状チューブの検査
- スペシャルプローブOSS-10を用いて、ボイラーチューブの酸化スケールを測定することによる、ボイラー性能のモニタリング

DMS Go+ ADVANCEDモデルには、金属の厚さ測定と同様にコーティングの厚さ測定が行えるTopCOAT機能を備えています。また、Auto-V測定機

能により、校正ブロックを使用することなく、音速が未知な機器の厚さ測定を行えます。



キーを押して画面の縦表示、横表示を選択

ソフトウェアの簡単なアップグレードで、どのモデルにも総合的かつ多機能な超音波探傷器の機能を追加

DMS Go+シリーズは、最新の携帯型超音波探傷器USM Go+と共通のオペレーティングプラットフォームを使用しています。よって、Aスコープ厚さ測定器と超音波探傷器を、同一の筐体に収めて使用することができます。

起動画面においていずれを使用するかを選択できます。アップグレードしたDMS Go+であれば、検査員はただ一つの探傷器を現場に持っていきただけで、信頼のおける厚さ測定および超音波探傷の両方を実施できることを意味します。



仕様

表示部	5インチ 800×480ピクセル 108×65mm (W×H) >400cd/m ²
外形寸法	175×111×50mm (W×H×D)
重量	877g
防塵・防滴	IP67
動作温度	0°C～+55°C
バッテリー	リチウムイオンバッテリー8時間以上
充電器兼ACアダプタ	100～240VAC、50/60Hz
探触子コネクタ	Dual Lemo 00×2
PCインターフェイス	Micro USB
メモ리카ード	SDカード (最大16GBメモ리카ード使用可)
データレコーダ (モデル別)	1ファイル約100,000測定値。SDカードに複数のファイルを保存可能 (8種類のファイル形式、Aスコープ、Bスコープ、MicroGrid表示)
パルサ	120～300V スパイクパルス 探触子毎に自動設定
繰り返しパルス周波数	4Hz、8Hz、16Hz
レシーバ (モデル別)	110dBダイナミックレンジ ゲイン自動調整/ユーザ設定: High、Low、自動
測定範囲	0.4～14,000mm
測定単位	mm、inch、μs
表示分解能	0.01mmまたは0.1mm
測定方法 (モデル別)	ゼロクロス測定、S-B1、B1-Bn、TopCoat、Auto-V
校正モード (モデル別)	1点校正 (自動、ゼロブロック、手動) 2点校正 自動Vパス補正
測定値表示 (モデル別)	厚さ測定値+Aスコープ、温度補正板厚測定 Bスコープ 最小値/最大値 差厚測定値
適合規格	EN 61010、EN 61326-1、EN 12668 ASTM E 1324、ASTM E 317、ANSI/NCSS Z 540-1-1994 MIL-STD 45662A、MIL-STD 2154、EN 15317

waygate-tech.com/jp

日本ベーカークヒューズ株式会社
非破壊検査機器事業本部

〒104-6023 東京都中央区晴海 1-8-10
晴海トリトンスクエア オフィスタワーX 23F
TEL : 03-6890-4567 FAX : 03-6864-1738
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-3-2
南船場ハートビル 8F
Tel : 06-6260-3106 FAX : 06-6260-3107

メール : BHJapanComms@bakerhughes.com

* 2020年7月15日付で日本ベーカークヒューズ株式会社にGEセンシング&インスペクション・テクノロジーズ株式会社から社名変更しました。

お問い合わせは...

Copyright 2019 Baker Hughes Company.本書には、1カ国以上のBaker Hughes Companyおよびその関連会社の複数の登録商標が含まれています。本書で言及するその他の企業名および製品名はそれぞれの所有者の商標です。*は1カ国以上のBaker Hughes Companyの登録商標です。全ての仕様および外観、本書の記載内容は予告なしに変更されることがあります。本書は英語文の参考翻訳文であり、常に英語版が優先されます。WT-20219JP_Rev.A (09/20)_2016/07改訂